

Thickness-Star FE

Schichtdicke messen einfach gemacht



In der Kupfergalvanik ist es technisch, wie auch ökonomisch entscheidend, welche Schichtdicke auf dem jeweiligen Ballen aufgetragen wird.

Das Thickness-Star FE von Daetwyler Graphics AG ist ein handliches und robustes Schichtdickmessgerät für präzise und zerstörungsfreie Messung von Kupferschichtdicken. Die Verwendung des Thickness-Star FE erhöht die Sicherheit, dass die zu bearbeitende Kupferschichtdicke nicht unterschritten wird. Dadurch sind die Schneidplättchen keinem unnötigen Verschleiß ausgesetzt.

Merkmale

- Klein wie eine Sonde
- Robustes Leichtmetallgehäuse (IP64) schützt vor Staub und Spritzwasser
- Kontrastreich beleuchtete OLED Grafik-Anzeige mit Bedienungsführung

Technische Spezifikationen

Messverfahren:	magnetinduktiv auf Eisen und Stahl	
Auflösung:	< 100 µm:	0.1 µm
	< 1000 µm:	1 µm
	ab 1.00 mm:	0.1 mm
Genauigkeit:	< 100 µm:	+/- 1 µm
	100 – 1000 µm:	+/- 1 %
	1000 – 2000 µm:	+/- 3 %
	> 2000 µm:	+/- 5 %
Stromverbrauch:	1 x 1.5V Mignon-Batterie (nicht enthalten)	
Gewicht:	ca. 72 g	
Lieferumfang:	Kalibrierinsel, Bedienungsanleitung, handlicher Koffer	
Bestellnummer:	600549	



Daetwyler Graphics AG
 Flugplatz
 CH-3368 Bleienbach/ Switzerland

Phone: +41 62 767 75 75
 parts@daetwyler-graphics.ch
 www.daetwyler-graphics.ch

v190221